

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60384-3-1

QC 300801

Première édition
First edition
1989-04

**Condensateurs fixes utilisés
dans les équipements électroniques –**

**Partie 3:
Spécification particulière-cadre –
Condensateurs fixes chipes au tantale
Niveau d'assurance E**

Fixed capacitors for use in electronic equipment –

**Part 3:
Blank detail specification –
Fixed tantalum chip capacitors
Assessment level E**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60384-3-1: 1989

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement
(Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60384-3-1

QC 300801

Première édition
First edition
1989-04

**Condensateurs fixes utilisés
dans les équipements électroniques –**

**Partie 3:
Spécification particulière-cadre –
Condensateurs fixes chipsets au tantale
Niveau d'assurance E**

Fixed capacitors for use in electronic equipment –

**Part 3:
Blank detail specification –
Fixed tantalum chip capacitors
Assessment level E**

© IEC 1989 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

N

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

Publication 384-3-1 de la CEI
QC 300801 (Première édition - 1989)

Condensateurs fixes utilisés dans
les équipements électroniques

Troisième partie:
Spécification particulière-cadre: Condensateurs
fixes chipse au tantale - Niveau d'assurance E

IEC Publication 384-3-1
QC 300801 (First edition - 1989)

Fixed capacitors for use
in electronic equipment

Part 3:
Blank detail specification: Fixed
tantalum chip capacitors. Assessment level E

C O R R I G E N D U M 1

Page 18

*Sous-groupe C3.1, sous colonnes
p | n | c, au lieu de:*

6 | 8 | 1

lire:

6 | 18 | 1

Page 26

*Sous-groupe C3.4, sous colonnes
p | n | c, au lieu de:*

3 | 4 | 1

lire:

3 | 24 | 1

Page 19

*Sub-group C3.1, columns
p | n | c, instead of:*

6 | 8 | 1

read:

6 | 18 | 1

Page 27

*Sub-group C3.4, columns
p | n | c, instead of:*

3 | 4 | 1

read:

3 | 24 | 1

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 60384-3-1:1989

Withdrawn

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
 TROISIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE:
 CONDENSATEURS FIXES CHIPSES AU TANTALE
 NIVEAU D'ASSURANCE E

PREAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes No. 40 de la CEI: Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapports de vote
40(BC)632	40(BC)668
40(BC)598	40(BC)646
40(BC)599	40(BC)647

Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports de vote correspondants mentionnés dans le tableau ci-dessus.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

- Publications 384-1(1982): Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques. Première partie: Spécification générique. Modifications No. 2 (1987) et No. 3 (1989).
 384-3(1989): Troisième partie: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes chipsets au tantale.
 410(1973): Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 3: BLANK DETAIL SPECIFICATION:
FIXED TANTALUM CHIP CAPACITORS
ASSESSMENT LEVEL E

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 40: Capacitors and Resistors for Electronic Equipment.

The text of this standard is based upon the following documents:

Six Months' Rule	Reports on Voting
40(CO)632	40(CO)668
40(CO)598	40(CO)646
40(CO)599	40(CO)647

Further information can be found in the relevant Reports on Voting indicated in the table above.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Other IEC Publications quoted in this standard:

- Publications 384-1(1982): Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment, Part 1: Generic Specification.
Amendments No.2 (1987) and No. 3 (1989).
384-3(1989): Part 3: Sectional Specification: Fixed Tantalum Chip Capacitors.
410(1973): Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.
-

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
TROISIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE:
CONDENSATEURS FIXES CHIPSES AU TANTALE
NIVEAU D'ASSURANCE E

INTRODUCTION

Spécification particulière-cadre

Une spécification particulière-cadre est un document, complémentaire de la spécification intermédiaire, comprenant les règles concernant le style, la présentation et le contenu minimal des spécifications particulières. Les spécifications particulières ne répondant pas à ces règles ne sont pas considérées comme conformes aux spécifications de la CEI et ne doivent pas être déclarées comme telles.

Le contenu du paragraphe 1.4 de la spécification intermédiaire doit être pris en compte lors de la préparation des spécifications particulières.

Les numéros placés entre parenthèses dans la première page correspondent aux informations suivantes, qui doivent être introduites à l'emplacement indiqué.

Identification de la spécification particulière

- (1) "Commission Electrotechnique Internationale" ou nom de l'Organisme National de Normalisation sous l'autorité duquel la spécification particulière est établie.
- (2) Numéro CEI ou national de la spécification particulière, date d'édition et toute autre information exigée par le système national.
- (3) Numéro et édition de la spécification générique nationale ou CEI.
- (4) Numéro CEI de la spécification particulière-cadre.

Identification du condensateur

- (5) Brève description du type de condensateur.
- (6) Indications sur la technologie de base (si applicable).
- (7) Croquis avec les principales dimensions, importantes pour l'interchangeabilité, et/ou références correspondant aux documents nationaux ou internationaux appropriés. Au choix, ce croquis peut être donné dans une annexe à la spécification particulière.
- (8) Utilisation ou ensemble d'utilisation couvertes et/ou niveau d'assurance.

Note.- Le(s) niveau(x) d'assurance utilisé(s) dans une spécification particulière doit(doivent) être choisi(s) dans la spécification intermédiaire, paragraphe 3.5.4. Ceci implique qu'une spécification particulière-cadre peut être utilisée en combinaison avec plusieurs niveaux d'assurance pourvu que le groupement des essais ne change pas.

- (9) Données relatives aux propriétés les plus importantes, permettant la comparaison entre les divers types de condensateurs.

FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 3: BLANK DETAIL SPECIFICATION:
FIXED TANTALUM CHIP CAPACITORS
ASSESSMENT LEVEL E

INTRODUCTION

Blank detail specification

A blank detail specification is a supplementary document to the Sectional Specification and contains requirements for style and layout and minimum content of detail specifications. Detail specifications not complying with these requirements may not be considered as being in accordance with IEC specifications nor shall they so be described.

In the preparation of detail specifications the content of Sub-clause 1.4 of the sectional specification shall be taken into account.

The numbers between brackets on the first page correspond to the following information which shall be inserted in the position indicated.

Identification of the detail specification

- (1) The "International Electrotechnical Commission" or the National Standards Organisation under whose authority the detail specification is drafted.
- (2) The IEC or National Standards number of the detail specification, date of issue and any further information required by the national system.
- (3) The number and issue number of the IEC or national Generic Specification.
- (4) The IEC number of the blank detail specification.

Identification of the capacitor

- (5) A short description of the type of capacitor.
- (6) Information on typical construction (when applicable).
- (7) Outline drawing with main dimensions which are of importance for interchangeability and/or reference to the national or international documents for outlines. Alternatively, this drawing may be given in an appendix to the detail specification.
- (8) Application or group of applications covered and/or assessment level.

Note. -The assessment level(s) to be used in a detail specification shall be selected from the sectional specification, Sub-clause 3.5.4. This implies that one blank detail specification may be used in combination with several assessment levels, provided the grouping of the tests does not change.

- (9) Reference data on the most important properties, to allow comparison between the various capacitor types.

(1)	CEI 384-3-1-XXX QC 300801-XXX	(2)
COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE QUALITE CONTROLEE CONFORMEMENT A:	CEI 384-3-1 QC 300801	(4)
(3)	CONDENSATEURS FIXES CHIPSES AU TANTALE	(5)
Croquis d'encombrement: (voir Tableau I) (Projection: Méthode du ... dièdre)		(6)
(7)		
(D'autres formes sont autorisées à l'intérieur des dimensions données)	Niveau(x) d'assurance: E	(8)

Les informations sur la disponibilité des composants qualifiés selon cette spécification particulière sont données dans la Liste des Produits Qualifiés.

(9)

SECTION UN - CARACTERISTIQUES GENERALES

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

1.1 METHODE(S) DE MONTAGE RECOMMANDEE(S) (à introduire)

(Voir paragraphes 1.4.2 et 4.3 de la Publication 384-3 de la CEI.)

(1)	IEC 384-3-1-XXX (2) QC 300801-XXX
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY IN ACCORDANCE WITH:	IEC 384-3-1 (4) QC 300801
(3)	FIXED TANTALUM CHIP CAPACITORS (5)
Outline drawing: (see Table I) (... angle projection)	(6)
(7)	(8)
(Other shapes are permitted within the dimensions given)	Assessment level(s): E (8)

Information on the availability of components
qualified to this detail specification is given
in the Qualified Products List.

(9)

SECTION ONE - GENERAL DATA

1. GENERAL DATA

1.1 RECOMMENDED METHOD(S) OF MOUNTING (to be inserted)

(See Sub-clauses 1.4.2 and 4.3 of IEC Publication 384-3.)

1.2 DIMENSIONS

TABLEAU I

Référence du boîtier	Dimensions (en mm ou en inches et mm)						
	Ø	L	H	d			

Notes 1. -Lorsqu'il n'y a pas de référence de boîtier, le tableau I peut être omis et les dimensions doivent être données dans le tableau IIA, qui devient alors tableau I.

2. -Les dimensions doivent être données en valeurs maximales ou en valeurs nominales avec tolérance.

1.3 CARACTERISTIQUES

Gamme de capacité	(voir tableau IIA)
Tolérances sur la capacité	
Tension nominale	(voir tableau IIA)
Tension de catégorie (si applicable)	(voir tableau IIA)
Catégorie climatique	
Température nominale	
Variation de capacité avec la température	(voir tableau IIB)
Tangente de l'angle de pertes	
Courant de fuite	(voir tableau IIB)
Impédance (si applicable)	(voir tableau IIC)
Résistance d'isolement (si requis)	
Tension de surtension	

TABLEAU IIA

Valeurs de capacité, de tension et boîtiers correspondants

Tension nominale				
Tension de catégorie*				
	Boîtier	Boîtier	Boîtier	Boîtier
Capacité nominale (en μF)				

* Si elle est différente de la tension nominale

1.2 DIMENSIONSTABLE I

Case size reference	Dimensions (in mm or inches and mm)						
	Ø	L	H	d			

Notes 1. -When there is no case size reference, Table I may be omitted and the dimensions shall be given in Table IIA, which then becomes Table I.

2. -The dimensions shall be given as maximum dimensions or as nominal dimensions with a tolerance.

1.3 RATINGS AND CHARACTERISTICS

Capacitance range	(see Table IIA)
Tolerance on rated capacitance	
Rated voltage	(see Table IIA)
Category voltage (if applicable)	(see Table IIA)
Climatic category	
Rated temperature	
Variation of capacitance with temperature	(see Table IIB)
Tangent of loss angle	
Leakage current	(see Table IIB)
Impedance (if applicable)	(see Table IIC)
Insulation resistance (if required)	
Surge voltage	

TABLE IIA

Values of capacitance and of voltage related to case sizes

Rated voltage				
Category voltage*				
	Case size	Case size	Case size	Case size
Rated capacitance (in μF)				

* If different from the rated voltage

TABLEAU IIB

Caractéristiques à haute et basse température

U_R (V)	C_R (μF)	Variation de capacité (%)			Valeurs maximales						
					Tan δ (%)				Courant de fuite (μA)		
		θ_A	θ_R	θ_B	θ_A	20 °C	θ_R	θ_B	20 °C	θ_R	θ_B 1)

 θ_A : Température minimale de catégorie θ_B : Température maximale de catégorie θ_R : Température nominale

1): Mesuré avec la tension de catégorie.

TABLEAU IIC

Impédance à 100 kHz (si applicable)

Boîtier	Impédance (Ω)

TABLE IIB

Characteristics at high and low temperature

U_R (V)	C_R (μF)	Capacitance change (%)			Maximum values						
					Tan δ (%)				Leakage current (μA)		
		θ_A	θ_R	θ_B	θ_A	20 °C	θ_R	θ_B	20 °C	θ_R	θ_B 1)

 θ_A : Lower category temperature θ_B : Upper category temperature θ_R : Rated temperature

1): Measured with category voltage.

TABLE IIC

Impedance at 100 kHz (if applicable)

Case size	Impedance (Ω)

1.4 DOCUMENTS DE REFERENCE

Spécification générique: Publication 384-1 de la CEI (1982):
Condensateurs fixes utilisés dans
les équipements électroniques.
Première partie: Spécification générique.
Modifications No. 2 (1987) et No. 3 (1989).

Spécification intermédiaire: Publication 384-3 de la CEI (1989):
Condensateurs fixes utilisés dans
les équipements électroniques.
Troisième partie: Spécification inter-
médiaire: Condensateurs fixes chipsets
au tantale.

1.5 MARQUAGE

Le marquage du condensateur (si appliqué) et de son emballage doit être conforme aux exigences de la Publication 384-3 de la CEI, paragraphe 1.6.

Note. -La spécification particulière doit indiquer les informations effectivement portées sur le condensateur et sur l'emballage.

1.6 RENSEIGNEMENTS POUR LES COMMANDES

Les commandes de condensateurs couverts par cette spécification doivent contenir au minimum, en clair ou en code, les renseignements suivants:

- a) Capacité nominale.
- b) Tolérance sur la capacité nominale.
- c) Tension nominale en courant continu.
- d) Numéro et numéro d'édition de la spécification particulière et référence du modèle.

1.7 RAPPORTS CERTIFIES DE LOTS ACCEPTEES

Requis/non requis.

1.8 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (ne sont pas prises en considération pour les contrôles)1.9 EXIGENCES OU SEVERITES, COMPLEMENTAIRES DE, OU PLUS SEVERES QUE, CELLES SPECIFIEES DANS LA SPECIFICATION GENERALE OU INTERMEDIAIRE

Note. -Des compléments ou des exigences complémentaires ne devraient être prescrites que lorsque cela est indispensable.

TABLEAU IIIAutres caractéristiques

Ce tableau doit être utilisé pour définir des caractéristiques qui sont complémentaires ou plus sévères que celles qui sont données dans la spécification intermédiaire.

1.4 RELATED DOCUMENTS

Generic specification: IEC Publication 384-1 (1982):
Fixed Capacitors for Use in Electronic
Equipment, Part 1: Generic Specification.
Amendments No. 2 (1987) and No. 3 (1989).

Sectional specification: IEC Publication 384-3 (1989):
Fixed Capacitors for Use in Electronic
Equipment, Part 3: Sectional Specifi-
cation: Fixed Tantalum Chip Capacitors.

1.5 MARKING

The marking of the capacitor (if applied) and the package shall be in accordance with the requirements of IEC Publication 384-3, Sub-clause 1.6.

Note. -The details of the marking of the component and package shall be given in full in the detail specification.

1.6 ORDERING INFORMATION

Orders for capacitors covered by this specification shall contain, in clear or in coded form, the following minimum information:

- a) Rated capacitance.
- b) Tolerance on rated capacitance.
- c) Rated d.c. voltage.
- d) Number and issue reference of the detail specification and style reference.

1.7 CERTIFIED RECORDS OF RELEASED LOTS

Required/not required.

1.8 ADDITIONAL INFORMATION (not for inspection purposes)1.9 ADDITIONAL OR INCREASED SEVERITIES OR REQUIREMENTS TO THOSE SPECIFIED IN THE GENERIC AND/OR SECTIONAL SPECIFICATION

Note. -Additions or increased requirements should be specified only when essential.

TABLE IIIOther characteristics

This table is to be used for defining characteristics which are additional to or more severe than those given in the sectional specification.

SECTION DEUX - EXIGENCES DE CONTROLE

2. EXIGENCES DE CONTROLE

2.1 Procédures

2.1.1 Pour l'homologation, la procédure doit être conforme au paragraphe 3.4 de la spécification intermédiaire, Publication 384-3 de la CEI.

2.1.2 Pour le contrôle de la conformité de la qualité, le programme d'essais, comprenant l'échantillonnage, la périodicité, les sévérités et les exigences est donné au tableau IV. La formation des lots de contrôle est régie par le paragraphe 3.5.1 de la spécification intermédiaire.

TABEAU IV

- Notes 1. -Les numéros de paragraphes indiqués pour les essais et les exigences renvoient à la spécification intermédiaire, Publication 384-3 de la CEI et à la section un de cette spécification.
2. -Les niveaux de contrôle et les NQA sont extraits de la Publication 410 de la CEI: Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs.
3. -Dans ce tableau: p = périodicité (en mois)
n = effectif de l'échantillon
c = critère d'acceptation (nombre admissible de défectueux)
D = destructif
ND = non destructif
NC = niveau de contrôle
NQA = niveau de qualité acceptable } Publication 410 de la CEI
4. -Non applicable aux condensateurs chipses qui, selon leur spécification particulière, doivent être montés sur des substrats en alumine.

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	N C	N Q A	Exigences (voir note 1)
			(voir note 2)		
<u>CONTROLE DU GROUPE A</u> (lot par lot)					
<u>Sous-groupe A1</u>	ND		S-4	2,5%	
4.4 Examen visuel					Selon 4.4.2 Marquage lisible et selon 1.5 de la présente spécification
4.4 Dimensions (par mesure)					Comme spécifié au tableau I de la présente spécification

SECTION TWO - INSPECTION REQUIREMENTS2. INSPECTION REQUIREMENTS2.1 Procedures

- 2.1.1 For Qualification Approval, the procedures shall be in accordance with the Sectional Specification, IEC Publication 384-3, Sub-clause 3.4.
- 2.1.2 For Quality Conformance Inspection, the test schedule (Table IV) includes sampling, periodicity, severities and requirements. The formation of inspection lots is covered by Sub-clause 3.5.1 of the Sectional Specification.

TABLE IV

- Notes 1. -Sub-clause numbers of tests and performance requirements refer to the Sectional Specification, IEC Publication 384-3 and Section One of this specification.
2. -Inspection Levels and AQL's are selected from IEC Publication 410: Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.
3. -In this table: p = periodicity (in months)
n = sample size
c = acceptance criterion (permitted number of defectives)
D = destructive
ND = non-destructive
IL = inspection level
AQL = acceptable quality level } IEC Publication 410
4. -Not applicable to chip capacitors, which according to their detail specification shall only be mounted on alumina substrates.

Sub-clause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	I L	A Q L	Performance requirements (see Note 1)
(see Note 2)					
<u>GROUP A INSPECTION</u> (lot-by-lot)					
<u>Sub-group A1</u>	ND		S-4	2.5%	
4.4 Visual examination					As in 4.4.2 Legible marking and as specified in 1.5 of this specification
4.4 Dimensions (detail)					As specified in Table I of this specification

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	N C N Q A (voir note 2)			Exigences (voir note 1)
<u>Sous-groupe A2</u>	ND		II	1,0%		
4.5.1 Courant de fuite		Résistance de protection: 1 000 Ω				$\leq 0,02 \text{ CU } \mu\text{A}/\mu\text{F.V}$ ou 1 μA , la plus grande des deux valeurs
4.5.2 Capacité		Fréquence: ... Hz				Dans les tolérances spécifiées
4.5.3 Tangente de l'angle de pertes ($\tan \delta$)		Fréquence: ... Hz				$\leq 0,06$ pour $U_R \geq 10 \text{ V}$ $\leq 0,08$ pour $6 \text{ V} \leq U_R < 10 \text{ V}$ $\leq 0,1$ pour $U_R < 6 \text{ V}$
<u>CONTROLE DU GROUPE B</u> (lot par lot)						
<u>Sous-groupe B1</u>	D		S-3	2,5%		
4.5.4 Impédance (si applicable)		Fréquence: 100 kHz				Selon tableau IIC
4.7 Soudabilité		Méthode: ...				
4.7.2 Mesures finales		Examen visuel				Selon 4.7.2
4.18 Résistance du marquage aux solvants* (si applicable)		Solvant: Température du solvant: ... Méthode: Matériau de frottement: coton hydrophile Reprise: ...				Marquage lisible

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	Effectif de l'échantillon et critère d'acceptation (voir note 3)			Exigences (voir note 1)
			p	n	c	
<u>CONTROLE DU GROUPE C</u> (périodique)						
<u>Sous-groupe C1</u>	D		3	12	1	
4.6 Résistance à la chaleur de soudage		Méthode: ... Durée: ... s Reprise: $24 \pm 2 \text{ h}$				

* Cet essai peut être effectué sur des condensateurs chipses montés sur un substrat.

Sub-clause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	I L	A Q L	Performance requirements (see Note 1)
			(see Note 2)		
<u>Sub-group A2</u>	ND		II	1.0%	
4.5.1 Leakage current		Protective resistance: 1 000 Ω			≤ 0.02 CU $\mu\text{A}/\mu\text{F.V}$ or 1 μA , whichever is the greater
4.5.2 Capacitance		Frequency: ... Hz			Within specified tolerance
4.5.3 Tangent of loss angle ($\tan \delta$)		Frequency: ... Hz			≤ 0.06 for $U_R \geq 10$ V ≤ 0.08 for 6 V $\leq U_R < 10$ V ≤ 0.1 for $U_R < 6$ V
<u>GROUP B INSPECTION</u> (lot-by-lot)					
<u>Sub-group B1</u>	D		S-3	2,5%	
4.5.4 Impedance (if applicable)		Frequency: 100 kHz			As in Table IIC
4.7 Solderability		Method: ...			
4.7.2 Final measurements		Visual examination			As in 4.7.2
4.18 Solvent resistance of the marking* (if applicable)		Solvent: ... Solvent temperature: ... Method 1 Rubbing material: cotton wool Recovery: ...			Legible marking

Sub-clause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	Sample size & criterion of acceptability (see Note 3)			Performance requirements (see Note 1)
			p	n	c	
<u>GROUP C INSPECTION</u> (periodic)						
<u>Sub-group C1</u>	D		3	12	1	
4.6 Resistance to soldering heat		Method: ... Duration: ... s Recovery: 24 $\pm$ 2 h				

* This test may be carried out on chip capacitors mounted on a substrate.

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	Effectif de l'échantillon et critère d'acceptation (voir note 3)			Exigences (voir note 1)
			p	n	c	
4.6.3 Mesures finales		Examen visuel Capacité Tangente de l'angle de pertes				Selon 4.6.3 Voir la spécifi- cation particulière
4.17 Résistance du composant aux solvants (si applicable)		Solvant: ... Température du solvant: ... Méthode 2 Reprise: ...				Voir la spécification particulière
<u>Sous-groupe C2</u>	D		3	12	1	
4.9 Robustesse des extrémités mé- tallisées (voir note 4)		Capacité (avec la carte imprimée en position pliée) Examen visuel				Voir la spécification particulière Pas de dommage visible
<u>Sous-groupe C3</u>	D					
4.3 Montage		Matériau du substrat: ...* Examen visuel Courant de fuite Capacité Tangente de l'angle de pertes Impédance (si applicable)				Selon 4.4.2 $\leq 0,02 \text{ CU } \mu\text{A}/\mu\text{F.V}$ ou 1 μA , la plus grande des deux valeurs $\frac{\Delta C}{C} \leq 3\%$ de la valeur C mesurée initiale- ment $\leq 0,06$ pour $U_R \geq 10 \text{ V}$ $\leq 0,08$ pour 6 $\text{V} \leq U_R < 10 \text{ V}$ $\leq 0,1$ pour $U_R < 6 \text{ V}$ Selon le tableau IIC
<u>Sous-groupe C3.1</u>	D					
4.8 Adhérence		Examen visuel				Pas de dommage visible
4.10.1 Mesure initiale		Capacité				

* Lorsque différents matériaux du substrat sont utilisés pour les sous-groupes individuellement, la spécification particulière doit indiquer quel matériau du substrat est

Sub-clause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	Sample size & criterion of acceptability (see Note 3)			Performance requirements (see Note 1)
			p	n	c	
4.6.3 Final measurements		Visual examination Capacitance Tangent of loss angle				As in 4.6.3 } See detail specification
4.17 Component solvent resistance (if applicable)		Solvent: ... Solvent temperature: ... Method 2 Recovery: ...				See detail specification
<u>Sub-group C2</u>	D		3	12	1	
4.9 Bond strength of the end face plating (see Note 4)		Capacitance (with printed board in bent position) Visual examination				See detail specification No visible damage
<u>Sub-group C3</u>	D					
4.3 Mounting		Substrate material: ...* Visual examination Leakage current Capacitance Tangent of loss angle Impedance (if applicable)				As in 4.4.2 $\leq 0.02 \text{ CU } \mu\text{A}/\mu\text{F.V}$ or $1 \mu\text{A}$, whichever is the greater $\frac{\Delta C}{C} \leq 3\%$ of value C measured initially ≤ 0.06 for $U_R \geq 10 \text{ V}$ ≤ 0.08 for $6 \text{ V} \leq U_R < 10 \text{ V}$ ≤ 0.1 for $U_R < 6 \text{ V}$ As in Table IIC
<u>Sub-group C3.1</u>	D					
4.8 Adhesion		Visual examination				No visible damage
4.10.1 Initial measurement		Capacitance	6	8	1	

* When different substrate materials are used for the individual sub-groups, the detail specification shall indicate which substrate material is used in each sub-group.

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	Effectif de l'échantillon et critère d'acceptation (voir note 3)			Exigences (voir note 1)
			p	n	c	
4.10 Variations rapides de température		θ_A = Température mini- male de catégorie θ_B = Température maxi- male de catégorie Cinq cycles Durée $t_1 = 30$ min Reprise: 1 à 2 h				
4.10.3 Mesures finales		Courant de fuite Capacité Tangente de l'angle de pertes				$\leq$ à la limite initiale Pour le modèle I: $\frac{\Delta C}{C} \leq 5\%$ Pour le modèle II: $\leq 10\%$ de la valeur mesurée en 4.10.1 $\leq$ à la limite initiale
4.11 Séquence climatique (uniquement pour le modèle I)						
4.11.1 Mesure initiale		Capacité				
4.11.2 Chaleur sèche		Température: température maximale de catégorie Durée: 16 h				
4.11.3 Essai cyclique de chaleur humide, essai Db, 1er cycle						
4.11.4 Froid		Température: température minimale de catégorie Durée: 2 h				
4.11.5 Essai cyclique de chaleur humide, essai Db, cycles restants		Reprise: 1 à 2 h				

Sub-clause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	Sample size & criterion of accepta- bility (see Note 3)			Performance requirements (see Note 1)
			p	n	c	
4.10 Rapid change of tempera- ture		θ_A = Lower category temperature θ_B = Upper category temperature Five cycles Duration $t_1 = 30$ min Recovery: 1 to 2 h				
4.10.3 Final measurements		Leakage current Capacitance Tangent of loss angle				$\leq$ initial limit $\frac{\Delta C}{C} \leq 5\%$ for Style I $\leq 10\%$ for Style II of value measured in 4.10.1 $\leq$ initial limit
4.11 Climatic sequence (Style I only)						
4.11.1 Initial measurement		Capacitance				
4.11.2 Dry heat		Temperature: upper category temperature Duration: 16 h				
4.11.3 Damp heat, cyclic, Test Db, first cycle						
4.11.4 Cold		Temperature: lower category temperature Duration: 2 h				
4.11.5 Damp heat, cyclic, Test Db, remain- ing cycles		Recovery: 1 to 2 h				

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	Effectif de l'échantillon et critère d'acceptation (voir note 3)			Exigences (voir note 1)
			p	n	c	
4.11.6 Mesures finales		Examen visuel Courant de fuite Capacité Tangente de l'angle de pertes				Pas de dommage visible Marquage lisible $\leq$ à la limite initiale $\frac{\Delta C}{C} \leq 10\%$ de la valeur mesurée en en 4.11.1 $\leq 1,2$ fois la limite initiale
<u>Sous-groupe C3.2</u>	D		6	9	1	
4.12 Essai continu de chaleur humide (uni- quement pour le modèle I)		Reprise: 1 à 2 h				
4.12.1 Mesure initiale		Capacité				
4.12.2 Mesures finales		Examen visuel Courant de fuite Capacité Tangente de l'angle de pertes				Pas de dommage visible Marquage lisible $\leq$ à la limite initiale $\frac{\Delta C}{C} \leq 10\%$ de la valeur mesurée en 4.12.1 $\leq 1,2$ fois la limite initiale
<u>Sous-groupe C3.3</u>	D		6	15	1	
4.13 Caractéristiques à haute et basse température		Les condensateurs doivent être mesurés à chaque palier de température <u>Palier 1: 20 °C</u> Courant de fuite Capacité Tangente de l'angle de pertes				} Valeurs utilisées comme référence

Sub-clause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	Sample size & criterion of accepta- bility (see Note 3)			Performance requirements (see Note 1)
			p	n	c	
4.11.6 Final measure- ments		Visual examination Leakage current Capacitance Tangent of loss angle				No visible damage Legible marking ≤ initial limit $\frac{\Delta C}{C} \leq 10\%$ of value measured in 4.11.1 ≤ 1.2 times initial limit
<u>Sub-group C3.2</u>	D		6	9	1	
4.12 Damp heat, steady state (Style I only)		Recovery: 1 to 2 h				
4.12.1 Initial measurement		Capacitance				
4.12.2 Final measurements		Visual examination Leakage current Capacitance Tangent of loss angle				No visible damage Legible marking ≤ initial limit $\frac{\Delta C}{C} \leq 10\%$ of value measured in 4.12.1 ≤ 1.2 times initial limit
<u>Sub-group C3.3</u>	D		6	15	1	
4.13 Characteris- tics at high and low tempe- rature		The capacitors shall be measured at each temperature step <u>Step 1: 20 °C</u> Leakage current Capacitance Tangent of loss angle				} For use as reference values

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	Effectif de l'échantillon et critère d'acceptation (voir note 3)			Exigences (voir note 1)
			p	n	c	
		<u>Palier 2: Température minimale de catégorie</u> Capacité Tangente de l'angle de pertes <u>Palier 3: 20 °C</u> Courant de fuite Capacité Tangente de l'angle de pertes <u>Palier 4: 85 °C</u> Courant de fuite Capacité Tangente de l'angle de pertes <u>Palier 5: 125 °C</u> (si applicable) Courant de fuite Capacité Tangente de l'angle de pertes				$-12\% \leq \frac{\Delta C}{C} \leq 0\%$ de la valeur mesurée au palier 1 $\leq 0,12$ pour $U_R \geq 10$ V $\leq 0,15$ pour $6,3 \text{ V} \leq U_R < 10$ V $\leq 0,2$ pour $U_R < 6,3$ V $\leq$ à la limite initiale $\frac{\Delta C}{C} \leq 5\%$ de la valeur mesurée au palier 1 $\leq$ à la limite initiale $\leq 0,2$ CU $\mu\text{A}/\mu\text{F.V}$ ou $10 \mu\text{A}$, la plus grande des deux valeurs $\frac{\Delta C}{C} \leq +10\%$ de la valeur mesurée au palier 1 $\leq 0,12$ pour $U_R \geq 10$ V $\leq 0,15$ pour $6,3 \text{ V} \leq U_R < 10$ V $\leq 0,2$ pour $U_R < 6,3$ V $\leq 0,25$ CU $\mu\text{A}/\mu\text{F.V}$ ou $12,5 \mu\text{A}$, la plus grande des deux valeurs $\frac{\Delta C}{C} \leq +15\%$ de la valeur mesurée au palier 1 $\leq 0,15$ pour $U_R \geq 6,3$ V $\leq 0,2$ pour $U_R < 6,3$ V